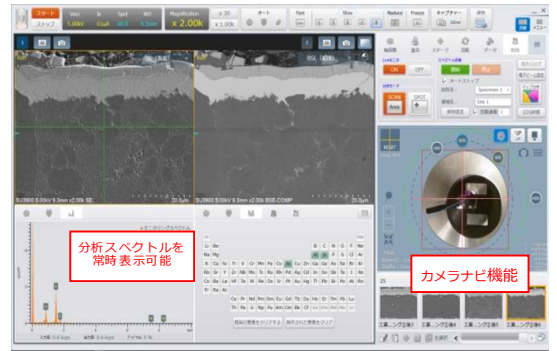


静岡県工業技術研究所 本所 (静岡)

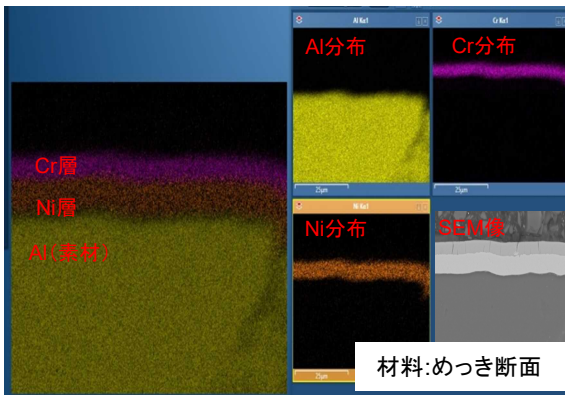
走査型電子顕微鏡



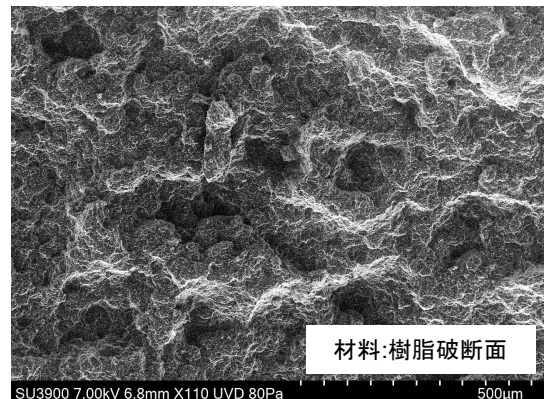
走査型電子顕微鏡外観



ライブ分析とカメラナビ機能



元素マッピング機能による分析例



低真空の凹凸 (二次電子) 像

走査型電子顕微鏡は、試料に電子線を照射して放出される二次電子等を検出することで、試料表面を拡大観察する装置です。光学式顕微鏡では観察不可能な高倍率(5,000倍以上)で、微小な表面構造を観察することができます。また、エネルギー分散型X線分析装置により、観察視野の任意の箇所を構成する元素を分析することが可能です。ご活用ください。

<主な用途>

- 金属部品や微小部品の観察、破断解析
- 食品や金属材料等への混入異物の確認
- 塗装やめっき部品の表面及び断面観察